

วิธีการวัดและวิเคราะห์

3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนิวเคลียร์อิมัลชันที่ใช้

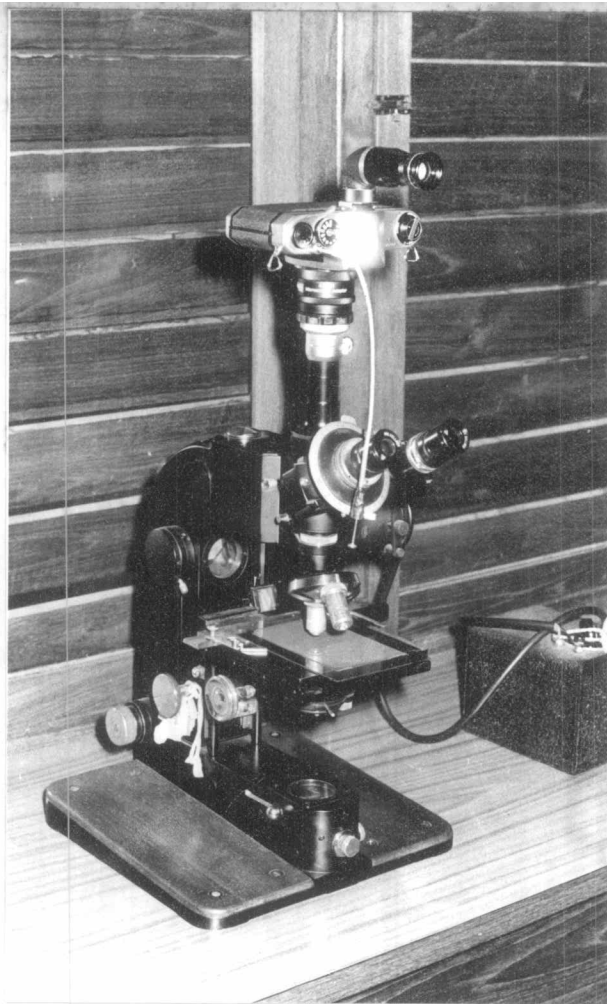
อิมัลชันซุก (stack emulsion) ที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้มี 3 ซุก คือ เค 5, เค 2 และ จี 5 ของบริษัทอิลฟอร์ด

เค 5 ได้มาจากศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งเมืองสตราบรุค ประเทศฝรั่งเศส แต่ละแผ่นมีขนาด 7.5×12 ตารางเซนติเมตร หนา 600 ไมครอนกอนกลาง และไคกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งแผ่นมี 42 แผ่น ไคส่งอิมัลชันซุกนี้ขึ้นไปรับรังสีคอสมิกปฐมภูมิในแนวขนานกับผิวของอิมัลชันที่ความสูง 158 กิโลเมตรเหนือพื้นดินควยจรวค Veronique (V.47) ของฝรั่งเศส ที่สถานีส่ง Habagir (Colomb Bechar) ในอาฟริกา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เวลาที่จรวคอยู่ในอากาศ (time of flight) ประมาณ 20 นาที สถานีตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 2 องศาเหนือและเส้นแวงที่ 32 องศาตะวันออก

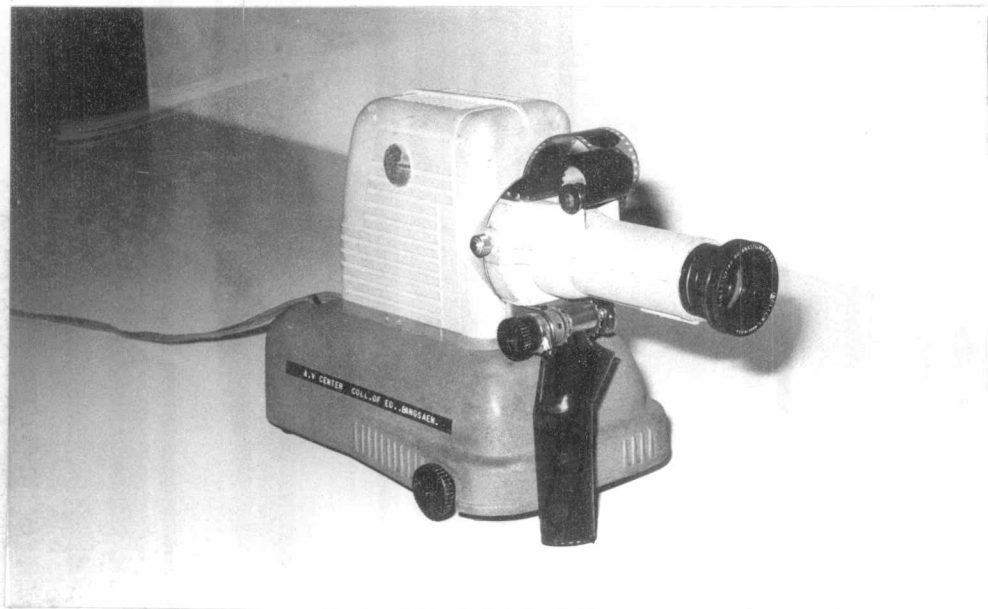
เค 2 แต่ละแผ่นมีขนาด 7.5×5.0 ตารางเซนติเมตร หนา 400 ไมครอน กอน-ล่างนี้รับรังสีที่ตกพิสัยถึง 1 จุดทดลองกรมมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 78 วัน ตั้งแต่ วันที่ 29 มกราคม ถึง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2506 ภายใต้เครื่องกั้นตะกั่วที่มีความหนา 0,1,2,3,5 และ 10 เซนติเมตร อิมัลชันซุกทั้งหมดมี 18 แผ่น

จี 5 แต่ละแผ่นมีขนาด 10.0×7.5 ตารางเซนติเมตร หนา 300 ไมครอนกอนล่างทั้งหมดมี 18 แผ่น นี้รับรังสีที่ตกพิสัยถึง 1 จุดทดลองกรมมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 6 เดือนเมื่อปี พ.ศ. 2505 อิมัลชันวางรับรังสีในแนวตะวันออกตะวันตก

สำหรับการล่างอิมัลชันแต่ละซุกนั้นได้ใช้กรรมวิธีอย่างเดียวกันหมด โดยวิธีรักษาอุณหภูมิ



รูปที่ 3-1 แสดงกล้องถ่ายภาพรวมต่อกับกล้องจุลทรรศน์



รูปที่ 3-2 เครื่องฉายภาพนิ่งแบบ Viewlex Model V-25

ให้ค่าที่ 5¹ ข. ตามวิธีของ Dilworth, Occhialini และ Payne¹ เวลาที่แช่อยู่ใน
 นำยาสร้างภาพ (developer) ประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับอิมัลชันชุด เค 2 มีการควบคุม
 อุณหภูมิไม่ผิดพลาด ทำให้มีความเข้มไม่สม่ำเสมอไปบ้างเป็นบางแผ่น

3.2 การหาเวลาของการฝั่งรับแสงในการถ่ายภาพของรอย (exposure time)

ในการวัดความกว้างของรอยได้ใช้วิธีการถ่ายรูปปลายของรอยซึ่งออกจากจุดควา
 และจบในอิมัลชัน การถ่ายรูปของรอยนี้ใช้กล้องถ่ายรูป Pentax โดยถอดเลนส์ของกล้องออก
 แล้วนำกล้องไปสวมเข้ากับกล้องจุลทรรศน์แบบ Cooke Troughton & Simms แบบ M40364
 ดังแสดงในรูปที่ 3-1 ใช้ฟิล์มซากูระ ASA 100

ในการให้ฟิล์มฝั่งรับแสงนั้น ใต้กล้องถ่ายภาพของรอยอันเดียวกัน ใช้เวลาต่างกัน
 โดยเริ่มตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 วินาที แล้วนำฟิล์มที่ฝั่งรับแสงแล้วไปล้าง โดยใช้เวลาล้างเท่ากันหมด
 7 นาที ต่อจากนั้นก็นำมาเข้าเครื่องฉายไปบนจอ แล้วพิจารณาเลือกเอาภาพที่เห็นรอยของ
 อนุภาคชัดที่สุด คือไม่ดำเกินไปและไม่ขาวจนเกินไป เพราะถ้าดำเกินไปทำให้ความลำบาก
 ในการวัด แต่ถ้าขาวเกินไปขอบรอยจะกลมกลืนกับภูมิหลัง (back ground) ทำให้ยาก
 แก่การวัดความกว้างเช่นกัน จากการพิจารณาเปรียบเทียบเวลาของการฝั่งรับแสงปรากฏว่า
 อิมัลชันชุด เค 5, เค 2 และ จี 5 ใช้เวลา 2.5, 1 และ 1 วินาทีตามลำดับ สำหรับภาพ
 ของรอยที่ใช้เวลาฝั่งรับแสงแตกต่างกันนั้นได้แสดงไว้ในรูปที่ 3-3

3.3 การเลือกรอยและวิธีการวัดความกว้างของรอย

004781

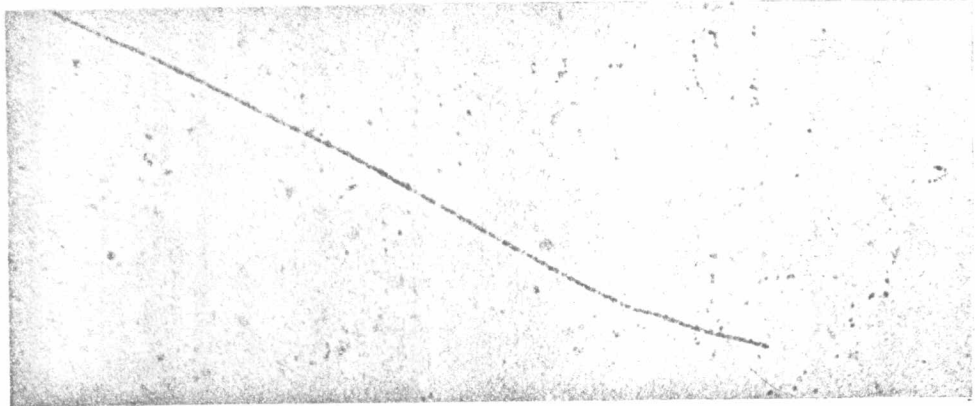
3.3.1 การเลือกรอย เนื่องจากวาร์รอยที่ปรากฏในอิมัลชันมีหลายชนิด แต่รอยที่จะ
 วัดนั้น ได้ใช้รอยที่เกิดจากจุดควา เพราะรอยที่เกิดจากจุดควาเป็นรอยของอนุภาคที่มีประจุ
 ต่างกันหลายชนิด รอยที่จะนำมาวัดนั้น นอกจากจะต้องจบในอิมัลชันแล้ว จะต้องทำมุม

¹

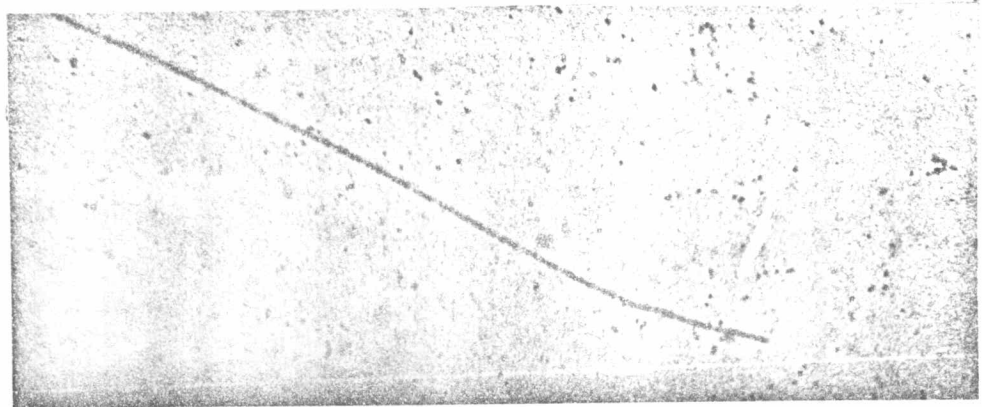
Dilworth C.C., Occhialini P.S., and Payne R.M., Nature,
 162(1948), p.102



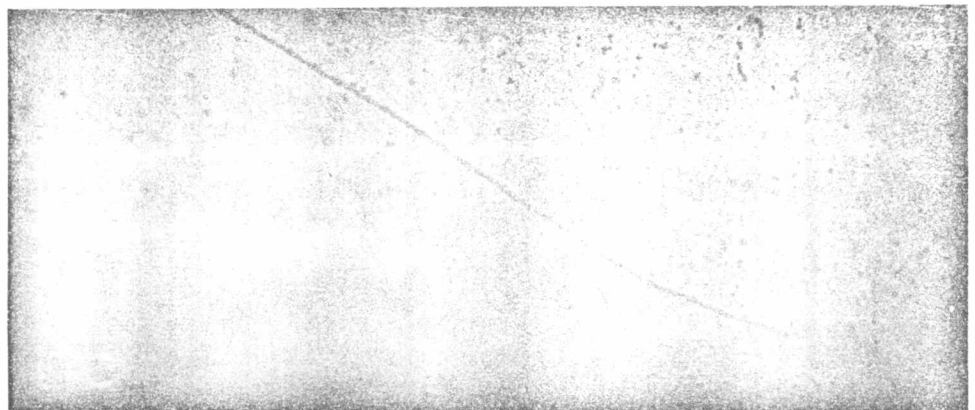
0.5 วินาที



1.0 วินาที

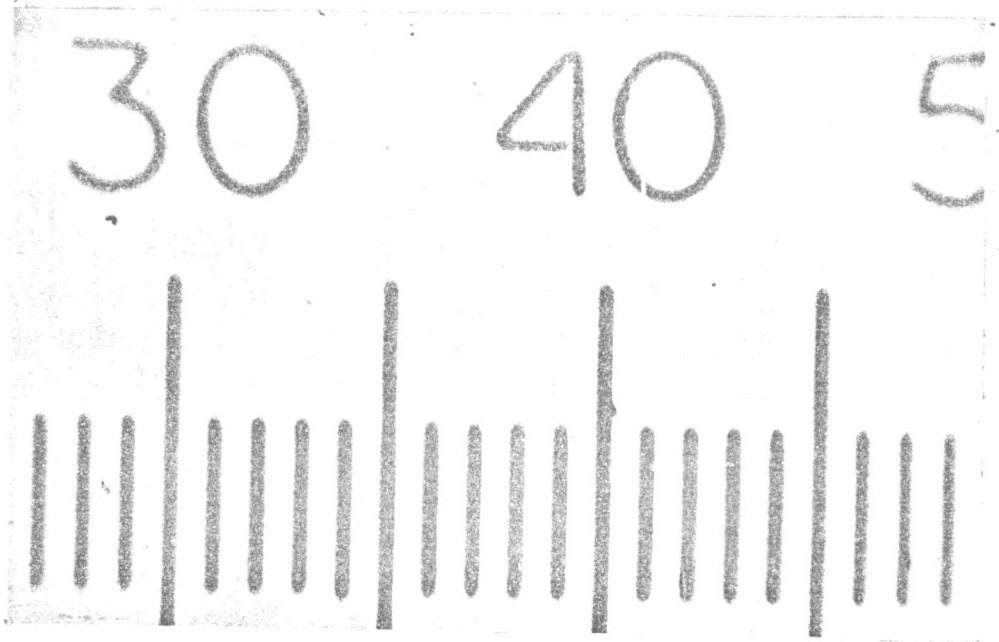


2.5 วินาที



5.0 วินาที

รูปที่ 3-3 แสดงภาพที่ใช้เวลายับแสงต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5.0 วินาที



รูปที่ 3-4 แสดงสเกลที่ใช้เป็นมาตรฐานระยะ 1 ม.ม. แบ่งเป็น 100 ช่อง



รูปที่ 3-5 แสดงรอยที่มีความเหมาะสมจะใช้วัดความกว้าง

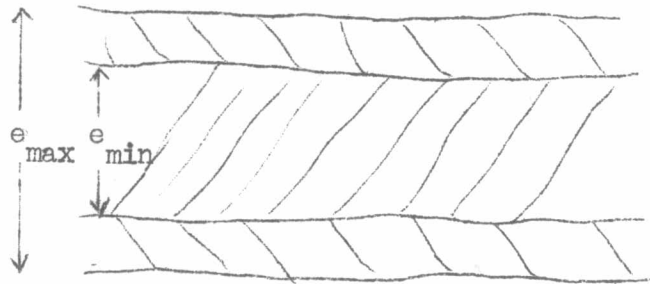
ไม่เกิน 15 องศา กับผิวหน้าของอิมัลชัน ถ้ามีมุมมากกว่านี้จะทำให้ภาพถ่ายของความยาวของรอยแต่ละครั้งสั้น วัตถุประสงค์ นอกจากนั้นจะต้องเป็นรอยที่มีความหนาแน่นของเม็ดเงินสูงมาก (black tracks) ซึ่งรอยเหล่านี้จะเป็นรอยของอนุภาคที่มีเลขอะตอมตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป

3.3.2 วิธีวัดความกว้างของรอย ในการส่องหารอยใช้เลนส์ใกล้ตาขนาด x15 และเลนส์ใกล้วัตถุขนาด x10 เมื่อพบรอยที่ต้องการแล้วในการถ่ายภาพของรอยได้ใช้เลนส์ใกล้วัตถุขนาด x45 เพื่อต้องการให้มีความละเอียดสูง ได้มีการถ่ายสเกล 1 มิลลิเมตร ที่แบ่งเป็น 100 ช่องไว้ด้วยทุกครั้งเพื่อเปลี่ยนฟิล์มม้วนใหม่ เพื่อไว้สำหรับเป็นมาตรฐานวัดระยะ แต่ละรอยจะได้รับการถ่ายภาพไว้สองครั้ง เพื่อว่าควมวัดได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด ภาพของรอยที่เหมาะสมในการวัดและสเกลได้แสดงไว้ในรูปที่ 3-4 และ 3-5

หลังจากล้างฟิล์มและตากให้แห้งแล้ว ให้นำฟิล์มไปเข้าเครื่องฉายภาพนิ่ง (projector) แบบ Viewlex Model V-25 ตั้งแสดงไว้ในรูปที่ 3-2 แล้วฉายภาพไปบนจอ โดยฉายตัวสเกลไปบนจอก่อนเพื่อทำเป็นมาตรฐานไว้ ปรับให้กำลังขยายเป็น 4000 เท่า โดยมีระยะห่างระหว่างจอกับเครื่องฉาย 5 เมตร และโคกระทำในห้องมืด การขยายขนาดนี้ จะทำให้วัตรอยโค้งงอและสละควงขึ้นมาก เพราะว่าความยาว 1 ไมครอน เมื่อฉายไปบนจอแล้วจะขยายได้เป็นระยะ 4 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถใช้คาลิเปอร์เวอร์เนียที่อ่านละเอียด 0.01 เซนติเมตรวัดได้ การวัดได้แบ่งความยาวของรอยออกเป็นช่วงๆโดยพยายามให้แต่ละช่วงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยประมาณ ซึ่งความยาวแต่ละช่วงที่เหมาะสมนั้นเป็น 5 ไมครอน วิธีวัดช่วงแรกได้เริ่มวัดจากปลายของรอยเข้ามา 2.5 ไมครอน จากนั้นได้วัดความกว้างทุกๆ 5 ไมครอนติดต่อกันไป

ความกว้างของรอยที่วัดได้ ส่วนมากจะไม่ถึง 1 ไมครอน ดังนั้นเมื่อรอยถูกขยายขึ้นอย่างมากมาย เวลาฉายไปบนจอจะเกิดการเลี้ยวเบนของแสง (diffraction) เกิดเป็นเงามัวๆตรงขอบของรอย ทำให้วัดความกว้างได้ไม่แน่นอน การวัดได้วัดตามกรรมวิธีของ Gegaulf² ซึ่งได้แนะนำว่าจากผลของการเลี้ยวเบนของแสงที่ทำให้ภาพของรอยเกิดมีเงามืด

และเงามัวเช่นนี้ ให้วัดความกว้างของรอยทั้งสองส่วนแล้วนำไปหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นความกว้างเฉลี่ยดังแสดงในภาพที่ 3-6

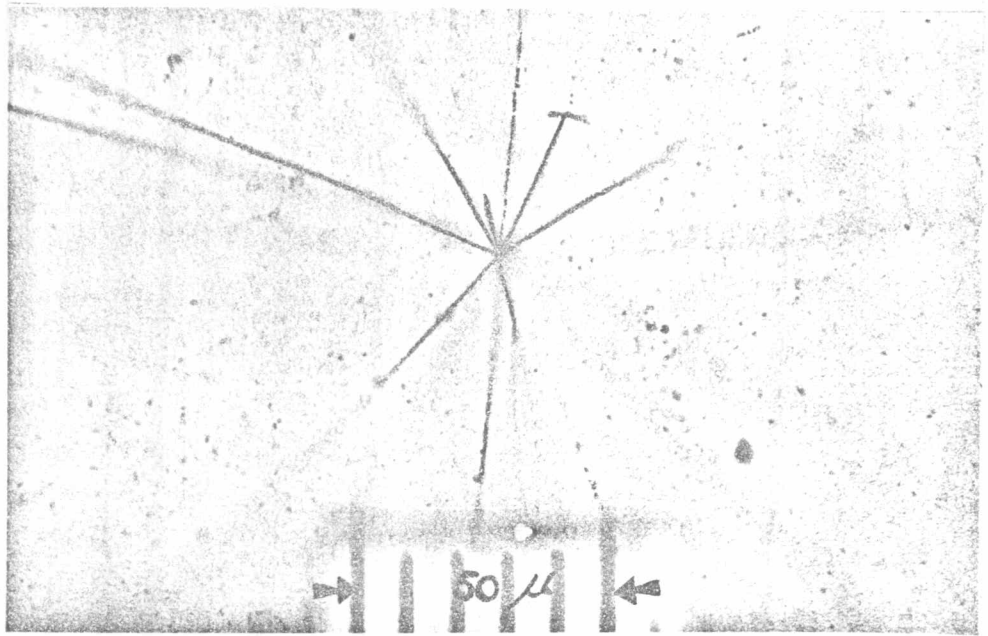


รูปที่ 3-6 ภาพแสดงรอยที่ฉายจากฟิล์มเนกเกทีฟไปปรากฏบนจอ e_{max} คือ ความกว้างของรอยที่เป็นเงามัว e_{min} คือความกว้างของรอยที่สว่างมากที่สุด

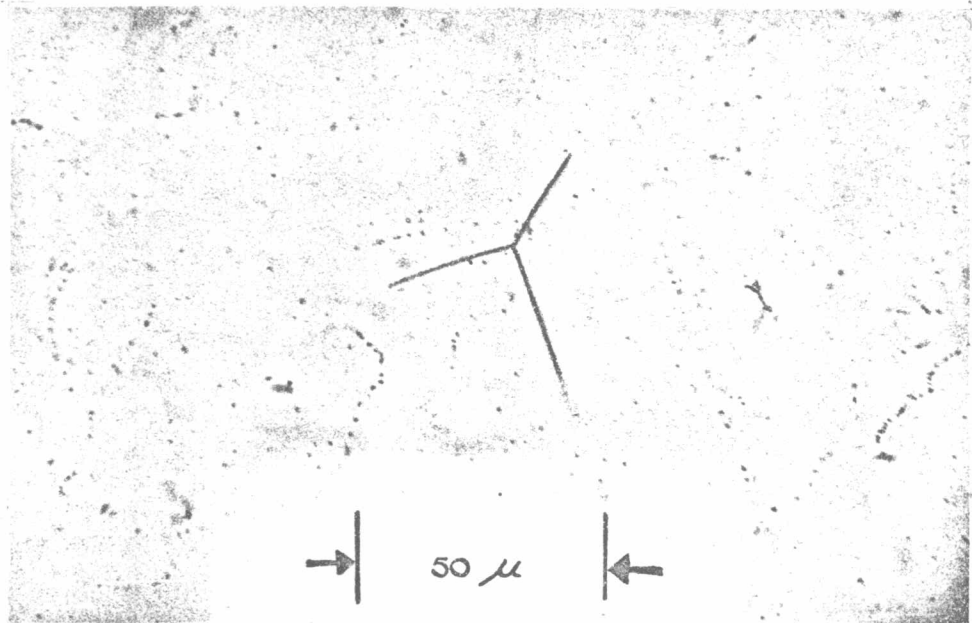
$$\text{ความกว้างเฉลี่ย} \quad e_{av} = \frac{e_{max} + e_{min}}{2}$$

3.4 การวิเคราะห์ความกว้างของรอย

จำนวนรอยที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่เท่ากัน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4-1 จากความกว้างของรอยต่างที่วัดได้ นำไปเขียนกราฟระหว่างความกว้างและพิสัย ปรากฏว่า รอยทั้งหมดแยกออกเป็น 5 กลุ่ม อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันหมดในอิมัลชันทั้ง 3 ชุด ดังแสดงในรูปที่ 4-1, 4-2 และ 4-3 ย่อมแสดงว่าความกว้างของรอยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน น่าจะเป็นรอยของอนุภาคชนิดเดียวกัน ซึ่งสามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยของความกว้างของรอยได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-3, 4-4 และ 4-5 สำหรับค่าเฉลี่ยในช่องสุดท้ายของตารางนั้น เฉลี่ยเฉพาะช่วงที่เลขระยะคืบไปแล้ว คือ กลุ่มที่ 2, 3, 4 และ 5 เฉลี่ยตั้งแต่พิสัย 12.5, 17.5, 22.5 และ 27.5 ไมครอน เป็นต้นไปตามลำดับ เหมือนกันทั้ง 3 ชุด ส่วนความคลาดเคลื่อนนั้นได้ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



รูปที่ 3-7 แสดงรอยรูปพจน ในอิมัลชัน เค 5



รูปที่ 3-8 แสดงรอยของอนุภาคอัลฟา จากกัมมันตภาพรังสีธอเวียม

3.4.1 สำหรับรอยในอิมัลชันชุด เก 5 และ จี 5 ได้ใช้รอยที่เป็นมาตรฐานเหมือนกัน คือใช้รอยรูปฆอน (hammer track) ดังแสดงในรูปที่ 3-7 ซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของรอยของนิวเคลียสของธาตุเบอรด์เลียมที่มีเลขอะตอมเป็น 4 เคลื่อนที่มาหยุดในอิมัลชันแล้วสลายตัวให้อนุภาคอัลฟา 2 ตัวในทิศทางตรงข้าม ตามสมการ



ปรากฏว่าเมื่อเขียนกราฟระหว่างความกว้างของรอยรูปฆอนกับพิสัยจะอยู่ในกลุ่มที่ 4 ดังแสดงในรูปที่ 4-1 และ 4-2 มาตรฐานอีกชนิดหนึ่งที่ใช่เป็นรอยของอนุภาคอัลฟาจากแร่กัมมันตภาพรังสีทอเรียม (radiothorium) ซึ่งมีป็นอยู่ทั่วไปในอิมัลชัน ภาพที่ปรากฏจะเป็นจุดดาวเล็กๆ ประกอบด้วยรอยสั้นๆ 3 รอยของอนุภาคอัลฟาออกจากจุดๆ เดียวกัน ทั้งหมดเท่ากันอยู่ในระนาบเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 3-8 จำนวนรอยของอนุภาคอัลฟาที่วัดได้แสดงในตารางที่ 4-2 ส่วนความกว้างเฉลี่ยของรอยได้แสดงในตารางที่ 4-6 เมื่อเขียนกราฟระหว่างพิสัยกับความกว้างเฉลี่ยของรอยปรากฏว่าความกว้างของรอยอยู่ในกลุ่มที่ 2

3.4.2 รอยในอิมัลชันชุด เก 2 ได้ใช้รอยของอนุภาคอัลฟาจากกัมมันตภาพรังสีทอเรียมเช่นเดียวกับ 3.4.1 ความกว้างของรอยอยู่ในกลุ่มที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 4-6 เช่นเดียวกัน

เนื่องจากไม่ปรากฏรอยที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะที่พอจะทำเป็นมาตรฐานอีกตัวหนึ่งได้ในอิมัลชันชุด เก 2 ดังนั้นเพื่อให้ได้ตัวมาตรฐานอีก จึงต้องใช้การนับความหนาแน่นของเม็ดเงินของรอยที่ยาว ปรากฏอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งน่าจะเป็นโปรตอนและอนุภาคอัลฟาตามลำดับ เพื่อวิเคราะห์ให้แน่ใจว่าเป็นโปรตอนและอนุภาคอัลฟาโดยใช้การนับความหนาแน่นของเม็ดเงิน (grain counting method) ตามกรรมวิธีการนับของ Lattes³ ในการนับให้นับเฉพาะช่วงที่อนุภาคเริ่มออกจากจุดดาว เพราะเป็นช่วงที่ความหนาแน่นของเม็ดเงินไม่มากนัก พอที่จะนับได้

3

Lattes, Occhialini and Powell, Proceedings of The Physical Society, 61(1948), p.173

เนื่องจากว่าความหนาแน่นของ เม็กเงินแปรผันโดยตรงกับพลังงานที่อนุภาคถ่ายเทให้กับอิมัลชัน ดังนั้น ถ้าให้ N เป็นความหนาแน่นของ เม็กเงิน และ $\frac{dE}{dx}$ เป็นอัตราการสูญเสียพลังงานต่อระยะทาง

$$N \propto \frac{dE}{dx}$$

และจากสมการ (2.1) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น

$$\frac{dE}{dx} = z^2 f(v)$$

เมื่อ z เป็นเลขอะตอมของอนุภาค

v เป็นความเร็วของอนุภาค

$$\text{ดังนั้น } N \propto z^2 f(v)$$

สำหรับกลุ่มที่ 2 เป็นอนุภาคอัลฟา ซึ่งมีเลขอะตอมเป็น 2

$$N_\alpha \propto f(v)$$

กลุ่มที่ 1 เป็นอนุภาคโปรตอน จะมีเลขอะตอมเป็น 1

$$N_p \propto f(v)$$

$$\text{หรือ } \frac{N_\alpha}{N_p} = 4$$

แสดงว่าที่ความเร็วเท่ากันอนุภาคอัลฟาจะมีความหนาแน่นเม็กเงินเป็น 4 เท่าของโปรตอน

เมื่ออนุภาคสองชนิด a และ b ที่มีความเร็วเท่ากัน ความสัมพันธ์ระหว่างพิสัยของอนุภาคทั้งสอง R_a และ R_b จะเขียนได้เป็น⁴

$$R_a = \frac{m_a \left(\frac{Z_b}{Z_a}\right)^2}{m_b} R_b + C(a,b) \quad (3.2)$$

⁴ Segre E., op.cit., p.177

เมื่อ m_a และ m_b เป็นมวลของอนุภาคทั้งสอง Z_a และ Z_b เป็นเลขอะตอม
ของอนุภาคทั้งสองตามลำดับ $C(a,b)$ เป็นค่าคงที่ จะมีค่าน้อยๆสำหรับอนุภาคที่มีเลขอะตอมต่ำๆ
เช่น โปรตอนและอนุภาคอัลฟา เป็นต้น

ถ้า a เป็นอนุภาคอัลฟา b เป็นโปรตอน

$$\frac{m_a}{m_b} = 4$$

$$\frac{Z_b}{Z_a} = \frac{1}{2}$$

จากสมการ (3.2) จะได้

$$R_a = R_b$$

แสดงว่าที่ความเร็วเท่ากัน โปรตอนและอนุภาคอัลฟาจะมีพิสัยเท่ากัน

ดังนั้นถ้าเขียนกราฟระหว่างความหนาแน่นเม็กเจินและพิสัยบนสเกลธรรมดา กราฟที่ได้
จะเป็นเส้นโค้ง แต่ถ้าเขียนกราฟระหว่าง \log ของความหนาแน่นเม็กเจิน และ \log
ของพิสัย กราฟที่ได้จะเป็นเส้นตรงซึ่งขนานกัน ดังแสดงในรูปที่ 4-7 อัตราส่วนของ
ความหนาแน่นเม็กเจินของอนุภาคอัลฟาและโปรตอนที่ความเร็วเท่ากันควรจะเท่ากับ 4
จากการวิเคราะห์ปรากฏว่าได้เท่ากับ 3.81 ± 0.33 ดังแสดงในตารางที่ 4-7
ซึ่งใช้จำนวนของรอยในกลุ่มที่ 1 เท่ากับ 13 เส้น และในกลุ่มที่ 2 เท่ากับ 15 เส้น
แสดงว่ารอยในกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นโปรตอนและอนุภาคอัลฟาตามลำดับ

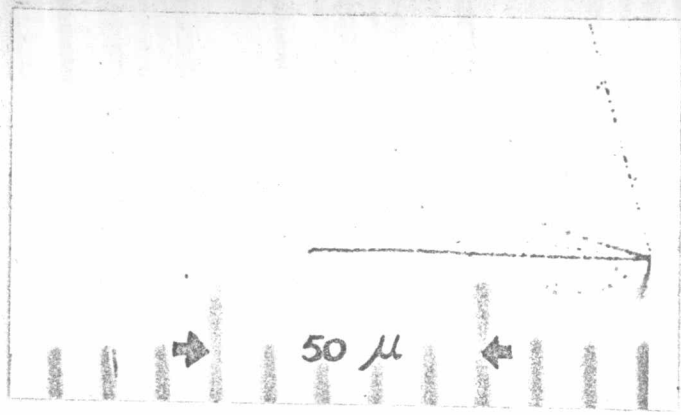
เมื่อทราบเลขอะตอมของรอย 2 กลุ่ม ก็สามารถที่จะใช้สมการ (2.7) หาค่าของ C
และ x ได้ ดังตัวอย่างวิธีคำนวณในหน้า 40 ปรากฏว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง
เฉลี่ยของรอยและเลขอะตอมจะเป็นดังนี้

อิมัลชันชุด เค 5

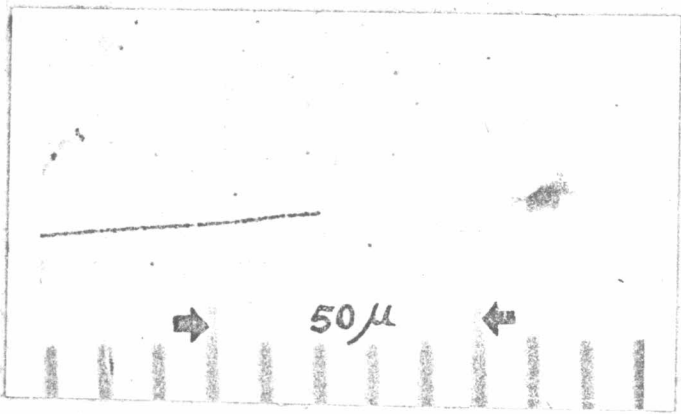
$$\bar{e} = 0.48 Z^{0.42} \quad (3.3)$$

อิมัลชันชุด เค 2

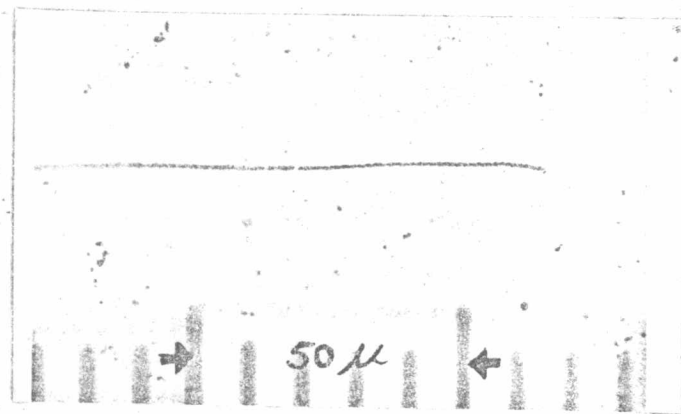
$$\bar{e} = 0.48 Z^{0.53} \quad (3.4)$$



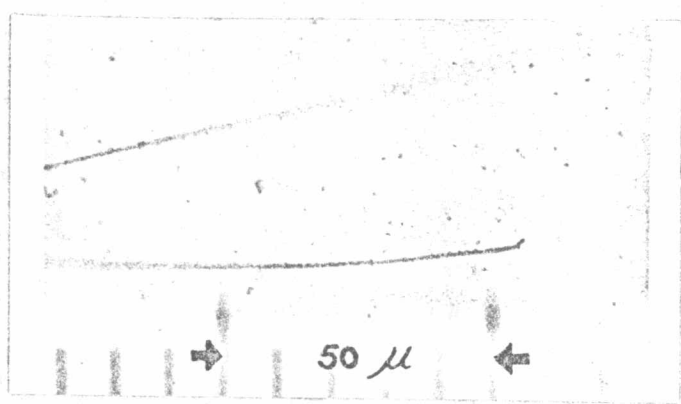
อนุภาคอัสฟา



ดิเทียม



เบอร์ซีเลียม



บอรอน

รูปที่ 3-9 แสดงปลายของรอยของอนุภาคในอินดิกัน เค 5

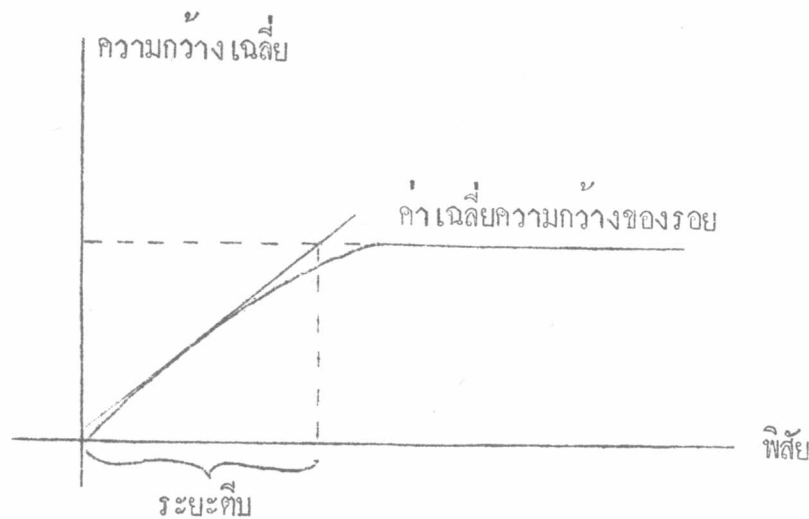
นิมิตชั้นชุด จี 5

$$\bar{e} = 0.53 z^{0.44} \quad (3.5)$$

จากสมการทั้งสามข้างต้นสามารถนำไปวิเคราะห์หรือยกกลุ่มอื่นๆ เพื่อหาเลขอะตอมได้
ดังแสดงในตารางที่ 4-8

3.5 วิถีวิเคราะห์ระยะتيب

เนื่องจากว่ากราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างเฉลี่ยและพิสัยจากรูปที่ 4-4
4-5 และ 4-6 สามารถแบ่งได้เป็นสองตอน ตอนแรกคือ ตอนที่แสดงค่าเฉลี่ยของความกว้าง
ซึ่งตรงกับตอนที่อนุภาคยังมีไดมิตาร์ เสียประจุและมีการสูญเสียพลังงานสูง เมื่อความเร็วลดลง
จนกระทั่งมีการจับกับอิเล็กตรอน ซึ่งความกว้างจะลดลงเป็นลำดับ การวิเคราะห์ระยะتيبจากปลาย
พิสัยไปถึงจุดตัดระหว่าง เส้นกราฟของช่วงที่เป็นระยะتيبและ เส้นที่เป็นค่าเฉลี่ยความกว้าง
ของรอย ดังแสดงในรูปที่ 3-10



รูปที่ 3-10 แสดงวิถีวิเคราะห์ระยะتيبของรอย

ระยะتيبของรอยของอนุภาคต่างๆ ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4-9 โดยสมมุติว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะتيبและเลขอะตอมเป็น $L = cz^a$ แล้วหาค่าตัวคงที่ c และ a

โดยใช้วิธีสแคว (least square) โดยใช้ \log ทั้งสองข้าง เพื่อทำให้เป็นสมการเส้นตรง จะได้

$$\log L = \log c + a \log Z$$

จากค่า L และ Z ในตารางที่ 4-9 สามารถที่จะหาค่า a และ c ได้ โดยได้แสดงวิธีหาไว้ในหน้า 43 ซึ่งจะได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะคืบและเลขอะตอมดังนี้

อิมัลชันชุด เก 5

$$L = 12.88 Z^{0.64} \quad (3.6)$$

อิมัลชันชุด เก 2

$$L = 13.13 Z^{0.54} \quad (3.7)$$

อิมัลชันชุด จี 5

$$L = 13.34 Z^{0.51} \quad (3.8)$$

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง L และ Z ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4-8, 4-9 และ 4-10